(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-21303

(43)公開日 平成6年(1994)1月28日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

FI

技術表示箇所

HOIL 23/50

G 9272-4M

庁内整理番号

S 9272-4M

審査請求 未請求 請求項の数3(全 3 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-176360

行照十4 — 17050

平成4年(1992)7月3日

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 丸茂 修一

長野県諏訪市大和3丁目3番5号セイコー

エプソン株式会社内

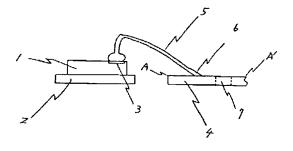
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体装置用リードフレーム及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】半導体装置を基板実装する際に、熱ストレスによるリード電極と樹脂の剥離を無くし、ステッチボンドの破断を防止する構造の半導体装置用リードフレームを提供する。

【構成】 I C チップとリードフレームと金属細線とを模 うように樹脂モールドして組立てる半導体装置におい て、前記リードフレームのステッチボンド部近傍には少 なくとも1つの穴部を形成し、この穴部形成をエッチン グまたはプレス法で行う構成の半導体装置用リードフレ ーム。



20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 I Cチップとリードフレームと金属細線と を覆うように樹脂モールドして組立てる半導体装置にお いて、前記リードフレームのステッチポンド部近傍には 少なくとも1つの穴部を形成した事を特徴とする半導体 装置用リードフレーム。

【請求項2】 穴部の形成をエッチングにより行なう事を 特徴とする請求項1記載の半導体装置用リードフレーム

【請求項3】 穴部の形成をプレスにより行う事を特徴と する請求項1記載の半導体装置用リードフレームの製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置用リードフ レームの構造に関する。

[0002]

【従来の技術】ICチップをプラスチックバッケージに 組立てる場合の一般的構造は、図3のように、タブ2上 に I C チップ 1 をエポキシ系接着剤などで固定し、パッ ド電極3とリード電極4を金属細線5で接続し、しかる 後にこれらを覆うように樹脂モールドするものであっ た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前述の従来技 術の図3に示す構造では、半導体装置を基板実装する際 に熱膨張差に起因する熱ストレスにより、リード電極4 の表面と樹脂モールドの間に剥離が生ずる事がある。そ れによりステッチボンド6が破断して電気的にオープン してしまうという問題を有する。

【0004】本発明はこの様な問題点を解決するもの で、その目的とするところは、ステッチポンド部近傍で リード電極と樹脂モールドの間に剥離を生じさせない半 導体装置用リードフレームを提供するところにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の半導体装置用リ ードフレームは、ステッチポンド部近傍に少なくとも1 つの穴部を形成した事、また穴部の形成をエッチングま たはプレスにより行う事を特徴とする。

[0006]

【実施例】図1は本発明の実施例の模式図である。なお 前述の従来例と同一部分には同じ符号を付してある。前 述の様に、基板実装する際の熱膨張差に起因する熱スト レスは、リード電板4の表面と樹脂モールドの間に剥離 を生じさせる。A-A'面においてA-A'に平行な方 面に力が働き剥離が生ずるわけであるが、ステッチボン ド6部近傍に穴部7を設けると、穴部の中に樹脂が入り 込んで固まる事により剥離が抑制されるのである。

【0007】穴部は、図1の様に貫通穴でも良いし、貫 通させず凹部としても良い。また製品評価の中でどのリ 50 7:穴部

ード電極において剥離が生じやすいか十分見極めた上 で、必要なリード電極のみに穴部を設けても良い。更に 穴部の平面的形状は円形、楕円形、正方形、長方形、三 角形等種々のものが考えられ、その大きさも重要であ る。これらは、リード電極の形状や幅及び強度を考慮し た上で決定すべきである。穴部は、その目的から、ステ ッチボンド部6に近い方が好ましい。従来リードフレー ムの樹脂モールドからの出口近傍に穴を設ける事が行な われていたが、これはリードフレームを樹脂モールドの 外側から引張ってリード抜けが無い様防止するもので、 本発明とはその目的と穴部の形成場所を異にするのであ る。

【0008】図2は、本発明の実施例における別の模式 凶を示すものである。すなわち、ステッチボンド6部の 近傍に、穴部を2個設けたものである。穴部が1つでは 効果が足りない場合、2個あるいはそれ以上設けても良 い。但し、この場合、リードフレームの強度について十 分注意を払う必要がある。

【0009】リードフレームの製造方法はエッチングに よるものと、プレスによるものが有り、電極数の少ない ものはプレス法、電極数の多いものはエッチング法によ るものが多い。その境界は約100程度のリード電極数 にある。したがって、穴部の形成方法は、リードフレー ムの他の部分の形成法と合わせてエッチング法またはプ レス法の内、適切な方を選択すれば良い。

【0010】この様に、ステッチボンド部近傍に穴部が 形成されているので、ここに樹脂が入り込んで固まりり ード電極表面と樹脂部の密着性を高める。その事によ り、リード電極と樹脂面の剥離を防止でき、ステッチボ ンドの破断が防止できる。

[0011]

【発明の効果】以上に述べたように本発明によれば、ス テッチボンド部近傍には少なくとも1つの穴部をエッチ ングまたはプレス法によって形成した事によりリード電 極と樹脂の剥離を防ぐ事ができ、それによるステッチボ ンドの破断が防止できるという効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の半導体装置用リードフレームの一実 施例を示す模式図。

【図2】 本発明の半導体装置用リードフレームの他の 実施例を示す模式図。

【図3】 従来の半導体装置リードフレームの模式図。 【符号の説明】

1:1 Cチップ

2:タブ

3:パッド電極

4:リード電極

5:金属細線

6:ステッチポンド

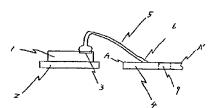
-12-

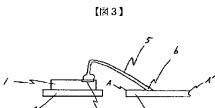
(3)

特開平6-21303

8:穴部

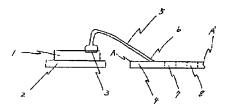
[図1]





【図2】

A-A':リード電極と樹脂の境界面



			·	•
				· ·
•				

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06021303

PUBLICATION DATE

28-01-94

APPLICATION DATE

03-07-92

APPLICATION NUMBER

04176360

APPLICANT: SEIKO EPSON CORP;

INVENTOR: MARUMO SHUICHI;

INT.CL.

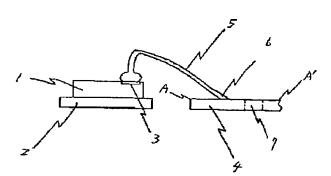
H01L 23/50

TITLE

: LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR

DEVICE AND MANUFACTURE

THEREOF



cited in the European Search Report of EPOA NO 06543-2203

Your Ref.: /4872

ABSTRACT :

PURPOSE: To prevent coming-off of a lead electrode from a resin mold by forming at least one hole part near a stitch bond of a lead frame by etching or press.

CONSTITUTION: Heat stress causes by a difference in the thermal expansion at the time of mounting a substrate causes coming-off between the surface of a lead electrode 4 and a resin mold. Coming-off causes when force works in the A-A' plane in the direction parallel to A-A', however, when a hole part 7 is provided near a stitch bond 6, resin enters inside the hole part for being solidified so as to heighten close adhesiveness between the lead electrode surface and the resin surface. Thereby, coming-off of the lead electrode 4 from the resin surface can be prevented while preventing breaking of the stitch bond 6.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio